

技術紹介

7 低接圧検査治具の開発

Development of Low contact pressure Probe Connector

高橋 威 Takeshi Takahashi コネクタ開発本部
高橋 拓也 Takuya Takahashi コネクタ開発本部 主任

キーワード：FPC 検査用コネクタ、低接圧、省スペース、高寿命

Keywords : FPC inspection connector, Low-contact pressure, Space-saving, Long life

要旨

携帯電話をはじめとするモバイル機器の多機能化、高性能化が急速に進み、カメラモジュール、液晶モジュール等の需要も大幅に伸びてきているなか、その検査用コネクタにおいても市場拡大が見込まれています。

それら検査用コネクタとしましては、現状プローブピンを使用したものが主流ですが、狭ピッチ化への対応困難、プローブピンによる打痕（被検査体への傷、ダメージ）等の問題点がクローズアップされており、ここに来て顧客から低接触圧、高寿命、高信頼性、及び狭ピッチ対応可能な検査用コネクタの要求が強く出てきています。

そこで、現在開発を進めている f-CONNECT を使用した FPC 検査用コネクタの検討を行い、0.3 mm ピッチ FPC 対応の検査用コネクタを開発することにより、顧客における問題点を解決することができました。

SUMMARY

Multifunction and high-performance of the mobile devices such as cellular phone are rapidly progressing and demand for the camera module, liquid crystal module, etc. is increasing. In this situation, market of the inspection connector for these modules is expected to expand.

Currently, the probe pin type connector is widely used for the inspection. But, some problems with the type, such as difficulty to support narrow pitch, dent by probe pin (injury and damage to inspected piece), etc., are being closed up, raising strong request from customers for new inspection connector to cope with narrow pitch with low-contact pressure, long life, and high-reliability.

As a result of our examination for the FPC inspection connector using f-CONNECT currently under development, we succeeded in settling the problems at customers by developing the FPC-support inspection connector with 0.3mm pitch.

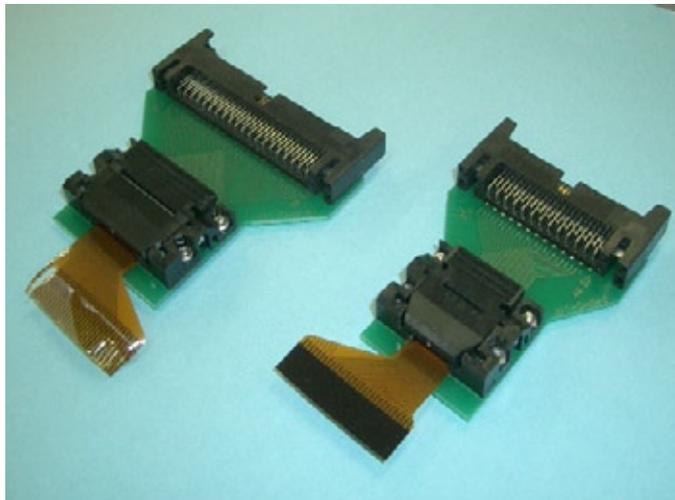


写真1 FPC 検査用コネクタ “XA1 コネクタ”